

半导体器件-X射线检查测试-百检网

产品名称	半导体器件-X射线检查测试-百检网
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测流程：1、电话沟通、确认需求；2、推荐方案、确认报价；3、邮寄样品、安排检测；4、进度跟踪、结果反馈；5、出具报告、售后服务；6、如需加急、优先处理；

1 倒装芯片拉脱 JEDEC JESD22-B109B:2014 倒装芯片拉脱

2 物理尺寸 JEDEC JESD22-B100B：2016 物理尺寸

3 外部目检 JEDEC JESD22-B101C:2015 外部目检

4 基于瞬态双界面法的单一路径散热半导体器件结壳热阻测试方法 JESD51-14 (2010) 热阻

5 半导体器件机械和气候试验方法 GB/T 4937-1995,IEC 60749-36-2003 第II篇 5 加速度

6 半导体器件机械和气候试验方法 GB/T 4937-1995,IEC 60749-8-2002 第III篇 7 密封

7 半导体器件 机械和气候试验方法 第12部分：扫频振动 GB/T 4937.12-2018,IEC 60749-12-2002 扫频振动

8 半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分：盐雾 GB/T 4937.13-2018,IEC 60749-13-2002 盐雾

9 半导体器件-机械和气候试验方法-第34部分：功率循环 IEC60749-34(Edition 2.0):2010 全部条款
全部条款 功率循环

10 半导体器件 机械和气候试验方法 第4部分：强加速稳态湿热试验（HAST） GB/T 4937.4-2012
全部条款 全部条款 强加速稳态湿热

11 半导体器件-机械和气候试验方法-第23部分：高温工作寿命 IEC60749-23(Edition 1.0):2004 全部条款
全部条款 高温反偏（HTRB）

12 半导体器件-机械和气候试验方法-第23部分：高温工作寿命 IEC60749-23(Edition 1.0):2004 全部条款
全部条款 高温栅偏（HTGB）

13 半导体器件 机械和气候试验方法 第2部分：低气压 GB/T 4937.2-2006 低气压

14 半导体器件 机械和气候试验方法 第12部分：扫频振动 GB/T 4937.12-2018 扫频振动

15 半导体器件 机械和气候试验方法 第13部分：盐雾 GB/T 4937.13-2018 盐雾试验